ONLINE MONITORING OF THE H0 DUMP BEAM CURRENT DURING USER OPERATION OF J-PARC RCS

Shuichiro Hatakeyama*A), Pranab SahaA), Masahiro YoshimotoA), Kazami YamamotoA), Naoki HayashiA), Kenichirou SatouB),

A) Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

2-4 Shirane Shirakata, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1195 Japan

B) High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801 Japan

Abstract

In J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex), the negative hydrogen ions(H-) accelerated by LINAC are converted to protons(H+) by the charge stripping foil before injecting into RCS(Rapid Cycling Synchrotron). About 99.6% of H- are stripped it's two electrons by the 1st foil. The rest of H0 and H- are converted to H+ by 2nd and 3rd foils and abandoned into H0 dump. Monitoring of the fraction of beam current into the H0 dump gives useful information for the stable beam supply during accelerator user's operation. This report describes the method of online monitoring to estimate the beam current of the H0 dump line.

J-PARC RCS 供用運転時のH0ダンプビーム電流のオンラインモニター

はじめに

J-PARC はLINAC(負水素イオン線形加速器)、RCS(早 い繰り返しの 3GeV 陽子シンクロトロン)、MR(主リン グ 30GeV 陽子シンクロトロン) とそれらを繋ぐビーム 輸送ラインから構成される。実験施設は、RCS からの 3GeV ビームを利用する MLF(物質生命科学実験施設) と MR からの 30GeV ビームを利用するニュートリノ、ハ ドロンの原子核素粒子実験施設がある。RCS では二つ の RF バケツの中に幅 600ns に切り分けられた多数の 中間ビームバンチを重複して入射することによりビー ム強度を最大 1MW(現在供用運転中は 120kW) まで増 大させる。このとき入射ビーム (H-) は荷電変換フォイ ル $^{[1]}$ (平均厚み $196\mu g/cm^2$ の炭素膜) によって H+に変 換される。荷電変換されない粒子は H0 ダンプに捨てら れるが、その電流を測定するために CT(電流モニター, 以下 HOCT と呼ぶ) と ESM(静電誘導型モニター) [2] の 2種類のモニターが設置されている。本稿では、HOCT を用いて H0 ダンプに流れるビーム電流を常時モニター するための手法を述べる。

2. RCS入射ビームライン概要

図1にRCSの入射・周回ビーム軌道を上方から眺めた概念図を示す。LINACからビーム輸送ライン(L3BT)を経由して来たH-と、周回軌道のH+はシフトバンプ(SB1,SB2)の磁場によって対照的に内側に偏向され同一軌道上に乗る。入射されたH-は第1荷電変換フォイルで約99.6%が電子を2つ剥ぎ取られH+となりシフトバンプ(SB3,SB4)によって周回ビームと同じ方向に偏向される。一方、第1荷電変換フォイルで変換されずにわずかに残ったH0、H-は、第2、第3フォイルによってH+に変換された後、H0ダンプラインに導かれダンプされる。この図ではH0ダンプラインにあるH0CT以外の機器は省略してある。RCSでは入射ビームを位相空間上に一様に分布させるペイント入射を行っており、

実際には入射軌道は周回軌道に対してオフセットと角度を持っている。1 サイクル分のビームが入射されると、フォイルとの多重散乱によるビームロスをなくすためにシフトバンプの磁場はゼロになり周回ビームは加速され、キッカー電磁石で MLF と MR に向け取り出される。以上のサイクルが 25Hz で行われる。

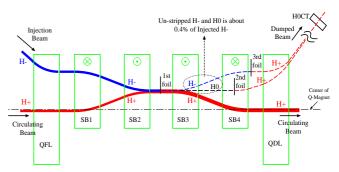


図 1: RCS 入射・周回軌道の概念図

3. H0CT 測定系

HOCT は HO ダンプの直前に設置された電流モニターで、コアには比透磁率 $2.3 \times 10^4 (f < 1 \text{kHz})$, 内径 245 mm, 外径 285 mm, 厚さ 75 mm のファインメットを用い、20 ターンのコイルを巻き付けてある。測定系を図 2 に示す。HOCT の信号は加速トンネルから分離されたメインテナンス用のトンネルにあるゲイン 100 倍のプリアンプで増幅され、地上部の制御室にあるバッファーアンプに接続される。バッファーアンプの出力は 3 系統に分かれ、そのうち 2 系統は積分器を通った後、HO ダンプの容量 (4kW) を越えないためのインターロックとして使用される。残りの 1 系統は、オシロスコープに接続され、EPICS 1 の IOC(Input Output Controler) によって波形が読み込まれる。

^{*} hatake@post.j-parc.jp

¹ANL,LANL で開発された加速器や大型測定装置のための分散型 制御システム及びソフトウェア開発環境

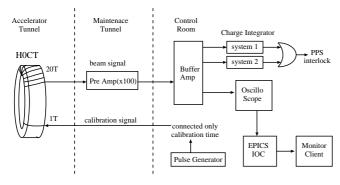


図 2: H0CT 測定系

4. 波形生成器を用いた H0CT の校正

HOCT には1ターンの校正用のコイルが巻いてあり、それに任意波形生成器からビームの模擬信号として幅600ns、繰り返し0.94MHz(RCS 181MeV 入射時のRF周波数)の矩形パルス信号を送って校正を行った。図3は模擬波形(下段:黄色)とHOCTの出力波形(上段:青色)のスクリーンショットである。

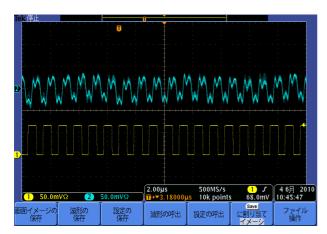


図 3: 校正用模擬信号(下)と H0CT 出力波形(上)

図4はHOCTへの入力波高が265mVのときのHOCTの出力信号をオシロスコープで1024回平均したときの波形である。上のグラフが時間領域、下が周波数領域で表示している。周波数領域への変換は、EPICSでデータ取得後、式(1)の離散フーリエ変換を行った。

$$Y_m = \sum_{n=0}^{N-1} W_n \cdot X_n \cdot e^{-2\pi i \frac{n \cdot m}{N}}$$
 (1)

ここで Y_m は $m \times 5$ kHz の周波数領域での振幅、 X_n は $n \times 10$ ns の時間領域での振幅、i は虚数単位、N=20000 である。離散フーリエ変換のツールとして、MIT で開発されたフリーソフトである FFTW (ver.3.1.2) を用いた。また FFTW には窓関数が実装されていないので、自前で式 (2) の Blackman 関数を当てはめ使用した。

$$W_n = 0.42 - 0.5\cos(\frac{2\pi n}{N}) + 0.08\cos(\frac{4\pi n}{N})$$
 (2)

図 4 の周波数領域の波形の 4 つのピークは、それぞれ 0.94MHz の基本波、2、3、4 倍の高調波である。

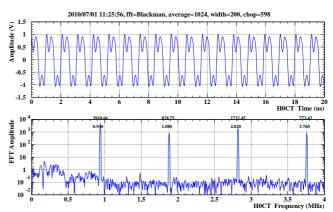


図 4: 入力 265mV: H0CT 出力波形

図 5 は入力波高が 1.5 mV のときの H0CT の出力波形である。時間領域表示では外来ノイズにより歪んで見えるが、周波数領域では 0.94 MHz の基本波のピークがはっきりと見える。J-PARC の供用運転時に予想されるH0CT の出力波高は LINAC からのビーム電流が 16 mAとして 10 mV 程度であるので十分検波可能である。

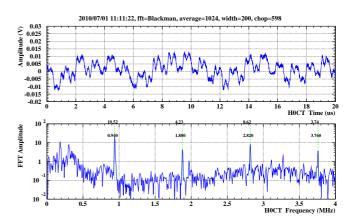


図 5: 入力 1.5mV: H0CT 出力波形

図 6 の上のグラフは、横軸が入力波高 (mV)、縦軸が H0CT の 0.94MHz の基本波を検波したときの振幅 (単位はカウント数) である。1 点につき 10 回データをとっており、誤差棒は標準偏差を σ として、 $\sigma/\sqrt{10}$ である。青い線は直線でフィットしたときの結果で傾きは 14.89 count/mV となった。図 6 の下のグラフはデータの平均値とフィットした直線の相対的なずれを表しており、1mV 以上では ± 1 % 以下の精度であっている。

5. 入射ビームを用いた電流値の規格化

 ${
m HOCT}$ で測定されるビーム電流の絶対値を規格化するために第 1 荷電変換フォイルをビームライン上から抜き 100% ${
m HO}$ ダンプにビームが行く状態で測定した。図 7 はそのときの ${
m HOCT}$ の波形である。入射ビームの条件は ${
m MLF}$ 行きの供用運転と同じく、イオン源のマクロパルス幅が $200\mu {
m s}$ 、チョップされた中間バンチのパルス幅が

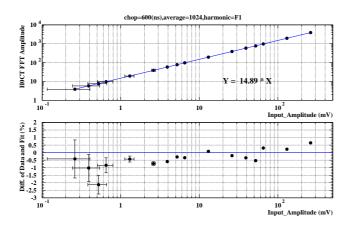


図 6: 入力波高と出力波高 (FFT) の線形性

600ns、横方向ペイント 150π 、縦方向ペイントありで、繰り返しはダンプの容量を越えないように 1Hz で 32 サイクル分の波形の平均値を取った。 0.94MHz の基本波の振幅は 7680 カウントであった。このときの RCS に入射する直前のビーム電流は L3BT に設置された SCT76の電流値を用いて測定され、平均値で 16.85mA であったので 456count/mA という結果となった。

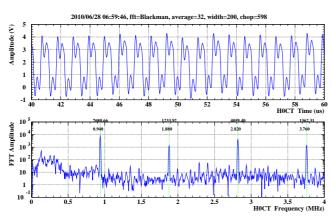


図 7: 100% ダンプさせたときの H0CT 波形

6. 供用運転中の HOCT の電流値の変化

今年の 6 月の供用運転中はマクロパルス幅と繰り返しが、MLF 行きが 200μ s/25Hz、MR ニュートリノ行きが 500μ s/0.284Hz であった。HOCT の電流モニターは S/N をよくするために、1024 回波形を平均する必要がある ため、25Hz の MLF 行きのビームのみ選んで電流値の モニターを行った。

図8にMLF供用運転中のHOCTの波形を示す。入射電磁石機器からのノイズが信号線にのっているため時間領域では中間バンチの波形は殆ど見えない。周波数領域では0.94MHzの基本波がかろうじて検波できる。3.76MHzの4倍高調波のピークは基本波より4倍近く高いがスケールが比例直線にのらないので、ビーム電流測定には基本波の方を用いることにした。

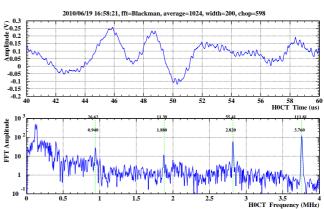


図 8: MLF 供用運転中の H0CT 波形

図9に今年の6/17から6/24の7日間のMLF行きのH0CT(上段:緑)とL3BT-SCT76(中段:青)の電流値の変化を示す。下段の赤いプロットはH0CTとL3BT-SCT76の電流値の比率で、およそ0.2~0.3%で安定して推移している。一部大きく変動しているところは、試験中で中間バンチ数を間引いたりパルス幅を変えたりして基本波のピークの規格化が適用できなかったところである。

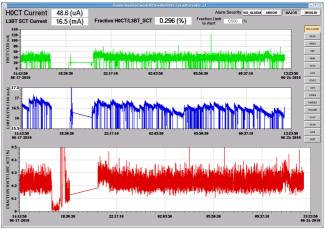


図 9: 7 日間の H0CT(緑)、L3BT-SCT76(青) の電流値と 比率 (赤) の変化

7. まとめ

J-PARC の MLF 供用運転中の H0CT の電流値を連続的にモニターした。入射ビーム電流に対する比率は約0.2~0.3%で安定して推移している。これからの課題として入射機器のノイズ対策をして測定精度を上げていきたい。

参考文献

- M.Yoshimoto, et al., "Improvements of the Charge Exchange System at the 3GeV RCS in J-PARC", Proceedings of IPAC10, Kyoto, May 2010.
- [2] K.Satou et al., "Injection and dump line monitor system of J-PARC RCS", Proceedings of the 4th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Wako, Aug. 2007